# 质子束流强刻度系统进展

### 报告人: 吕游

#### 2023年10月19日 高能质子实验终端技术讨论会





China Spallation Neutron Source

3

源

国散裂



- 流强刻度系统技术方案
- 塑闪辐照测试
- 多打拿极读出PMT探测器测试进展
- ●总结
- 二次电子发射监测器



## 质子束引出时间结构

#### 使用环散射器将高能质子从RCS环中引出





- ✓ 加速器脉冲频率25Hz,包括两个束团,束团脉宽为80ns,束团之间间隔410ns
- ✓ 在束流引出前的1-1.5ms内,每个束团经过引出点之后都会引出微量质子脉冲 (经过环散射器2400-3600次)
- ✓ 脉冲之间间隔410ns, 脉冲粒子个数1-10000个



### ◆高能质子束线引出参数

- ✓ 质子能量: 0.8~1.6 GeV
- ✓ 束流脉冲宽度: 80ns
- ✓ 脉冲重复频率: 410ns
- ✓ 引出时间: 1-1.5ms (2400-3600次)
- ✓ 束斑尺寸: ¢100mm
- ✓ 束流引出阶段单个脉冲束流粒子个数: 1-10000

### ◆流强探测器测量需求

- ✓ 调试阶段给出单个脉冲内束流粒子个数
- ✓ 高效率, 快响应
- ✓ 考虑噪声, 探测器信号幅度满足: 0.3-10000 mip
- 1. 脉冲束,无法进行计数测量,
- 2. 重复频率快, 难以采用电荷积分读出
- 3. 考虑到探测器噪声,要达到约30000倍的动态范围



### 流强刻度探测器基本方案

### ◆ 塑闪+PMT+波形采集方案

- ✓ 双闪烁体探测器做符合测试, 排除本底信号
- ✓ 塑闪对质子探测效率:~100%
- ✓ 塑闪发光时间:~3ns, PMT时间响应:~ns
- ✓ 采用多打拿极读出方案 (实现大动态范围)
- ✓ 波形采集卡、波形数字化读出电子学



探测器单元数	2
塑闪灵敏区面积	15cm*15cm
塑闪厚度	1cm
PMT打拿极个数	10
PMT打拿极读出通道数	3
探测器动态范围	~30000
探测效率	>97%@1.6GeV

探测器参数



塑闪+双打拿极读出PMT探测器波形

#### 2023-10-17

#### 高能质子实验终端技术讨论会

## 流强刻度探测器升级方案

塑闪受强辐照后性能会下降,需要手动更换闪烁体

- ◆ 液闪+PMT+波形采集方案
- 液闪与塑闪性能平替,同时能循环,可实现 自动化更换
- 预计能实现大动态范围流强的持续稳定测量
- 该方案正在研究中



探测方案	探头尺寸 ( <i>x</i> × <i>y</i> × <i>z</i> , <i>cm</i> )	材料	使用备注
塑料闪烁体方案	15  imes 15  imes 0.5	主要成分聚苯乙烯	准备十块塑闪,如发生性能下降, 立即更换。
液体闪烁体方案 (备用)	探测器15×15×1 SS外壳厚度1mm	主要成分甲苯	可实时自动循环和更新



### ● 流强刻度系统技术方案

● 塑闪辐照测试

● 多打拿极读出PMT探测器测试进展

- ●总结
- 二次电子发射监测器







- ◆ 塑闪参数
- ✓ 塑闪尺寸: 45 mm \*45 mm\*10 mm
- ✓ 密度: 1.023 g/cm3
- ◆ 沉积能量计算
- ✓ 80 MeV质子穿越10 mm塑闪沉积能量9.09 MeV, 1.6 GeV质子沉积能量2.02 MeV
- ✓ 一个80 MeV质子辐照相当于4.5个1.6 GeV质子辐照

- ◆分组对照实验
- ✓ 编号Plastic1-6 BC408塑闪进行最短5分钟, 最长20小时辐照
- ✓ 设置Plastic9和Plastic10不辐照作为对照组

## 放射源测试平台

实验原理图







3D打印支架



封装的PMT+塑闪+放射源



## 辐照前后塑闪颜色对比



	80	)MeV质子辐照塑)	习		1.6 C	1.6 GeV质子辐照塑闪		
塑闪编号	质子能量	1 cm塑闪能量沉	吸收剂量	质子能量	1 cm塑闪能量沉积	相当1.6 GeV 质子辐照数量	相对100 kW发次	
	(MeV)	积 (MeV/p)	Gy/cm <sup>3</sup>	(GeV)	(MeV/p)			
Plastic-6	80	9.08	3846	1.6	2.02	1.2E+13	0.8	
Plastic-5	80	9.08	18460.8	1.6	2.02	5.8E+13	3.7	
Plastic-4	80	9.08	36921.6	1.6	2.02	1.2E+14	7.5	
Plastic-3	80	9.08	184608	1.6	2.02	5.8E+14	37.4	
Plastic-2	80	9.08	369216	1.6	2.02	1.2E+15	74.8	
Plastic-1	80	9.08	923040	1.6	2.02	2.9E+15	187.0	

#### 2023-10-17

## 辐照前后发射光谱

#### 塑闪发光机制

- 溶剂:聚乙烯基甲苯,激发退激后发光 300-350 nm;
- 2.
- 第一溶质:无辐射方式或再吸收方式吸收退激后发光 350-400 nm; 波长位移剂:吸收溶质产生的荧光再发光 400-500 nm 蓝绿荧光。 3.



#### 辐照前后对比

- 光谱主峰峰位基本不变。
- ✓ 辐照时间越长, 荧光强度越低。

编号	峰位	峰值	峰值相对变化
Plastic1	343.7	2698	57.8%
Plastic2	343.9	4141	35.1%
Plastic3	343.7	5710	10.1%
Plastic4	343.1	6234	2.3%
Plastic5	343.7	6432	-0.8%
Plastic6	343.7	6544	-2.5%
Plastic9	343.7	6379	
Plastic10	343.9	6389	

质子辐照塑闪以后,破坏塑闪发光机制,损伤了塑闪发光成份。

高能质子实验终端技术讨论会

## 辐照前后Am241放射源响应对比



- ◆ 辐照前能谱:本底@1000 mV, 平均值@14300 mV
- ◆ 质子辐照塑闪以后, 塑闪光产额变成差, 辐照时间越长, 损伤效果越大。

辐照情况	塑闪编号	Plastic1	Plastic2	Plastic3	Plastic4	Plastic5	Plastic6	Plastic9	Plastic10
质子辐照前	5.5 MeV α	14100	14100	14300	13900	13500	14300	14700	15500
	峰位 (mV)								
	辐照时间	20 hours	8 hours	4 hours	48 mins	24 mins	5 mins	0	0
80 MeV 质子	吸收剂量	022040	260216	194609	26022	19461	2816	0	0
辐照后	(Gy)	923040	509210	104000	30922	10401	3040	U	U
	5.5 MeV α	1100	1100	2900	6900	9300	14700	14900	15100
	峰位 (mV)								
	相对辐照前	92.2%	92.2%	79.7%	50.4%	31.1%	-2.8%	-1.4%	2.6%
	变化								

表 3.3 质子辐照后塑闪对 <sup>241</sup>Am 放射源响应变化



◆ 吸收剂量小于3846 Gy时,不影响塑闪性能,吸收剂量大于369216 Gy塑闪完全失效。

- ◆ BC408塑闪能够承受1.2×10<sup>13</sup>量级的1.6 GeV的质子辐照。
- ◆ 束线流强10<sup>8</sup> protons/s计算,基于BC408塑闪的探测器可以使用33.3 小时。
- ◆ 塑闪能够满足高能质子束线流强的刻度需求。



### ● 流强刻度系统技术方案

### ● 塑闪辐照测试

### ● 多打拿极读出PMT探测器测试进展



### ● 二次电子发射监测器



## 塑闪和PMT需求

### ◆ 塑闪能量沉积

- ✓ 闪烁体尺寸设计为15cm×15cm, 厚度为1cm
- ✓ 每个脉冲沉积能量: 2MeV~20GeV
- ✓ 塑闪光产额:~100eV
- ✓ 考虑光衰减、反射、传输后的光收集效率: ~0.05
- ✓ PMT光阴极量子效率以及光电子收集效率:~0.1
- ✓ 光电子数: 100 PEs/mip
- ◆ 平均每个脉冲包含100个质子,脉冲间隔410ns, PMT增益10<sup>5</sup>,阳极平均电流为:

 $I = \frac{Q}{t} = \frac{100 \times 10^9 \times 100 \times 10^5 \times 1.6 \times 10^{-19}}{410} = 0.4 mA$ 

✓ PMT阳极平均电流: 0.4 mA



1.6 GeV质子在10mm塑闪内的能量沉积情况

## PMT阳极信号波形模拟

- ◆ 考虑闪烁体荧光衰减时间 (3.3ns) 的影响,不考虑PMT的渡越时间分散 (<1ns)
- ✓ 10000次事例按照抛物线的时间结构分布到达的原始信号(脉宽80ns)。
- ✓ 束流时间结构: f(t)=-x(x-80)



束流脉宽时间远高于闪烁体荧光衰减时间,原始信号波形主要取决于束流脉冲时间结构

## 流强重建估计

Step1:模拟样本事例:78603个质子事例按照抛物线的时间结构分布 Step2:从样本事例中随机抽取一定事例ProtonNum(单个脉冲包含的质子个数) Step3:对塑闪的发光过程、PMT的光电转换过程、PMT的倍增过程进行泊松抽样

Step4: 计算探测器信号波形面积,得到PMT输出电荷量,并反推出质子事例数



2023-10-17

## 多打拿极读出PMT方案

### ◆ 探测器参数

- ✓ 动态范围@30000倍 (0.3mip-10000mip)
- ✓ 电子学动态范围约为100倍, PMT动态范围要 达到约300倍
- ✓ PMT分压电路方案、读出信号的打拿极位置 需要进行优化研究



基于电阻、电容的分压电路原理图

读出电极	增益	动态范围	信号幅度(事例同时到达)	信号幅度(脉宽80ns)
阳极	1E6	0.2mip-20mip	1.6pC/ns-160pC/ns	0.12pC/ns-12pC/ns
第8打拿极	6.5E4	3.1mip-310mip	1.6pC/ns-160pC/ns	0.12pC/ns-12pC/ns
第5打拿极	1000	200mip-20000mip	1.6pC/ns-160pC/ns	0.12pC/ns-12pC/ns

PMT各读出极参数

### 多打拿极读出PMT小型样机测试



双打拿极读出PMT



LED测试照片



典型的信号波形



三打拿极读出PMT

LED测试照片

#### 高能质子实验终端技术讨论会

## 动态范围测试结果



- ◆ 双打拿极读出PMT, 信号幅度较小时, 阳极信号的面积与Dy8信号面积比值约为15倍, 信号幅度较大时, 约为10倍。
- ◆ 三打拿极读出PMT, DY10信号面积约为DY8信号面积的6倍, Dy8信号面积约为Dy5信号面积的10倍。

### 增益线性测试结果

信号幅度 vs. 计数率



随着LED发光频率的增加,探测器Dy8、Dy10的信号幅度显著下降,Dy5的信号幅度明显上升

## 当前电阻、电容分压电路存在的问题

- 1. 单个脉冲有大量粒子入射时, 会在后几个打拿极上产生大量的电荷。
- 2. 电荷通过分压电路泄放, 泄放时间跟耦合电容和分压电阻相关。
- 3. 当电荷泄放不及时,会导致后面几个打拿极的分压下降,增益降低,前面级数的分压升高,增益升高。
- 4. 一般来说当分压器原始电流为阳极电流的数十倍时(~50倍),该效应可以忽略。



◆ 为了实现大动态范围,多打拿极读出PMT的阳极在单个脉冲入射质子束较多时,打拿极上会有较大电流(mA), 普通的基于电阻、电容的分压电路方案难以满足其应用需求。

### 基于三极管的分压电路设计



- 1. 流入分压电路的电流是对应打拿极电流的1/h<sub>fe</sub>,其中h<sub>fe</sub>为三极管的电流增益。
- 三极管的放大倍数足够大,使得打拿极上的电荷尽可能的经过三极管泄放,而流入分压电路的电流尽可能小。
- 3. 晶体管要有好的频率特性。



## 基于三极管分压电路PCB设计



PCB设计图

PCB实物图

◆ PCB板已经加工完成,有待进一步测试



- 1. 高能质子束线脉冲重复频率快(410ns),流强监测探测器需要较快的时间响应,并且具有极高的 动态范围(0.3-10000 mip)。
- 2. 对塑闪的辐照损伤效应进行了研究,评估了塑闪用于高能质子流强刻度系统的可行性。
- 3. 研制了基于塑闪+多打拿极读出PMT的探测器样机,使用LED光源对样机的动态范围、增益线性进行了测试研究。当前PMT样机的动态范围只能达到60,增益线性差。

### ◆下一步工作

- 1. 需要寻找一款阳极电流足够大的PMT(十mA量级)。
- 考虑电子学的动态范围,探测器的动态范围要达到300,当前设计方案探测器的动态范围只能 达到60左右,动态范围需要进一步提升。
- 3. 当前的设计方案存在探测器增益线性差的问题,需要对分压电路进行优化设计和进一步的测试。

### 二次电子发射监测器 (SEEM)



## 透射电离室TIC

10MeV质子注量率随束斑变化: 原理: 辐射质 外框 绝缘体 高压极 2.2E+6 2.0E+6 收集极 1.8E+6 实物:用于APEP流强监测 intensity 1.6E+6 1.4E+6  $3.4 \times 10^{6}$ /pulse 1.2E+6 1.0E+6  $1.4 \times 10^7$ /pulse 8.0E+5 1000 1500 2000 2500 3000 3500 500 0 sample times

适用于大气环境:需APEP测试噪声和信号强度





# BACKUP



## 辐照前后吸收光谱



可见光能区

- ◆ 300~350 nm: 辐照时间越长, 吸光度越大。
- ◆ 350~400 nm: 辐照时间越长, 吸光度越小。
- ◆ >400 nm: 样品辐照时间低于 8 小时, 辐照越长, 吸光度越大, 但辐照 20 小时样品吸光度要小于辐照 8 小时样品吸光度。